

LPC TF Meeting Minutes

Rev. 1.0

Date 21 April 2017

Venue SEMI Japan

Name of Co-Leaders

[Name] / [Company]

Agenda

- Agenda Review
- Welcome and Self Introduction
 - (Check Attendees List)
- SEMI Standards Legal Reminders
- Review of the previous meeting minutes
(or former action item review)
- Summary & Action Items

Participants

- Tomita/Toshiba memory
- Araki/Screen Semiconductor Solutions
- Nagafuchi/Nihon Entegris
- Mizuno/Nihon Pall
- Kondo/Rion
- Sugawara/Organo
- Ehara/AIST
- Kato/AIST
- Tsuzuki/Nihon Pall
- Yokoi/Kurita
- Hamada/Daikin

SEMI Standards Legal Reminders



Std Legal
Reminders_150327_

Review of the previous meeting minutes (or former action item review)

前回議事録

開催日時:2012年7月20日 10時～11時



Microsoft Word
文書

C77



Adobe Acrobat
Document

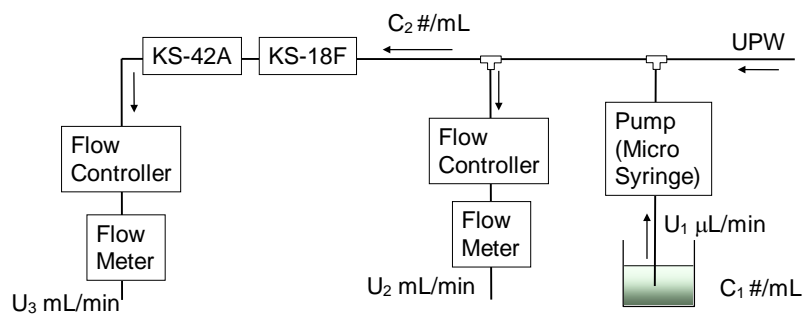
Summary & Action Items

- C77-0912 Test method for determining the counting efficiency of liquid-borne particle counters for which the minimum detectable particle size is between 30 nm and 100 nm の5年見直しについて
- 試験用粒子の市場状況は5年前と変化しておらず、校正証明された個数濃度標準粒子(粒径：30nm – 100nm)は、PSL粒子以外(SiO₂, Auコロイダルなど)でも現時点で製品化されていない。現時点で試験粒子に関しての変更は困難。
- LPCの性能は、ここ5年間で進歩している。そこで、タイトル、purpose等で規定している対象粒径範囲の変更が提案された。討議の結果、現時点では対象粒径範囲を変更しないことがTFとして合意された。
- C77-0912は、editorial changeの範囲で修正して継続とすることがTFとして合意され、本委員会に諮ることとした。なお、提出はCycle7を目処とする。
- Editorial changeの具体的な箇所は、委員間で情報交換をして、別途事務局に連絡する。

Backup

参考資料:C-77に基づいた、LPCの濃度依存特性の試験例

Schematic diagram of testing system

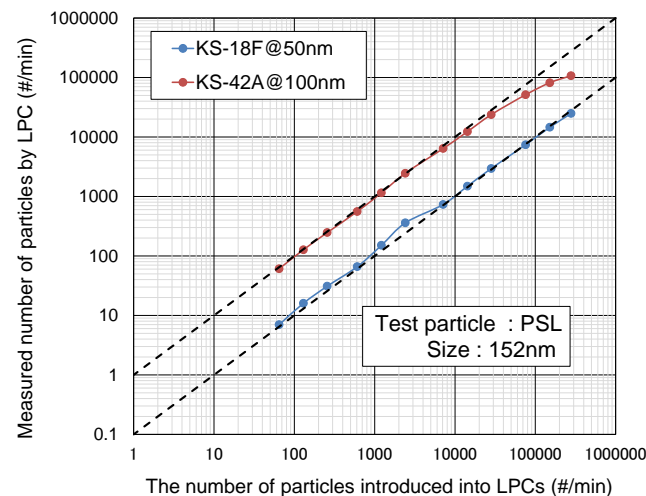


Test particle
Manufacture : JSR
Type : SC-016-S
material : PSL (ρ_p : 1.065)
median diameter : 152nm
mass concentration : 1%



1

Measurement results



2